

高温老化寿命试验-可靠性测试-第三方检测机构

产品名称	高温老化寿命试验-可靠性测试-第三方检测机构
公司名称	中科检测技术服务（广州）股份有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:中科检测 资质:CMA/CNAS 服务内容:高温老化寿命试验
公司地址	广州市天河区兴科路368号
联系电话	18127993660 13926209354

产品详情

高温变老寿命试验(HTOL)

参考标准：JESD22-A108；

广州中科检测是原信息产业部电子元器件602计量站，根据50很多年的发展趋向，早已变为一家国内各地化、综合性的公有制第三方计量检测机构，专注于为顾客给与计量检测、检测、认证以及技术咨询与培训等技术服务，在计量检定、可靠性与地理环境试验、电子元器件选择与失效分析检测、车规电子元器件认证检验、电磁兼容测试检测等诸多行业领域的技术水平及工作流程企业规模处于我国水平。

GRGT目前具有以下解决处理芯片相关检验专业能力及技术服务专业能力：

解决处理芯片可靠性验证(RA)：

芯片级准备解决(PC)&MSL试验、J-STD-020&JESD22-A113；

高温存储试验(HTSL),JESD22-A103；

温度循环试验(TC),JESD22-A104；

温湿度记录实验(TH/THB),JESD22-A101 ;

高加速热应力试验(HTSL/HAST),JESD22-A110 ;

高温变老寿命试验(HTOL),JESD22-A108 ;

解决处理芯片尖端放电检验(ESD) :

人体蓄电池充放电方法检验(HBM),JS001 ;

电子元器件蓄电池充放电方法检验(CDM),JS002 ;

闩锁检测(LU),JESD78 ;

TLP ; Surge/EOS/EFT ;

解决处理芯片IC失效分析(FA) :

光电子器件检查(VI/OM) ;

电子显微镜检查(FIB/SEM)

微芒分析精确定位(EMMI/InGaAs) ;

OBIRCH ; Micro-probe;

调焦离子束外部效应分析(FIB) ;

广州中科检测失效分析实验室AEC-Q专业性卓越团队，推行过许多的AEC-Q检验案例，积累了充沛的认证试验工作经历，可为您给与可靠的AEC-Q认证试验服务。

GRGT卓越团队专业性专业能力 :

电子元器件失效分析、解决处理芯片达标率提升、封装类型制作工艺管控

电子元器件竞品分析、制作工艺分析

芯片级失效分析方案turnkey

芯片级尖端放电安全防护测试标准与综合服务平台实验设计方案

尖端放电安全防护失效整治专业性建议

电子元器件可靠性验证

材料分析服务保障与方案

半导体元器件分析方法

芯片测试详细地址：中科检测-广州公司总部试验室。

